

1. Record Nr.	UNINA9910872506903321
Titolo	2000 5th International Workshop on Statistical Metrology
Pubbl/distr/stampa	[Place of publication not identified], : I E E E, 2000
Descrizione fisica	1 online resource (90 pages) : illustrations
Disciplina	621.3815/2/0287
Soggetti	Semiconductors - Characterization - Statistical methods Semiconductors
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Note generali	Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph